## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

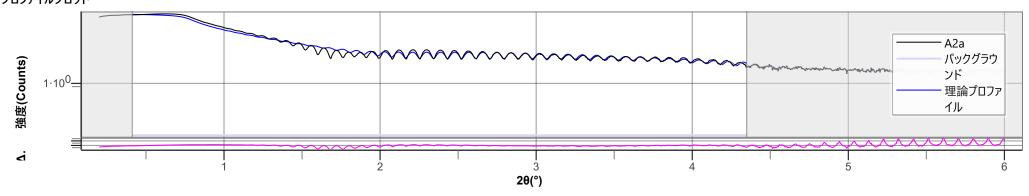
ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果 プロファイルプロット



使用		層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>		L5	Fe2O3	2.162	Const	2.50460	Const	0.316	Con
				±2	精密化	±0.2 最小←	精密化	±0.4	精密化
$\checkmark$		L4	Fe2O3	0.434	Const	4.95000	Const	0.198	Con
		L3	Fe Fe	0.000	Const	4.86619	Const	82.354	Con
				±0.5 最小←	精密化	±5	精密化	±0.12	精密化
<b>~</b>		L2	. Fe	92.032	Const	7.87400	Const	0.100	Con
$\checkmark$		L1	Fe	3.300	Const	5.03104	Const	0.100	Con
$\checkmark$		基板	🖸 Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con